



圖 13-47 Low k 材料降低金屬間電容，可有效改善時間延遲現象。

13.3 RF 電性量測

由於各種無線通訊產品皆由各種主被動半導體元件及電路所構成，其中高頻半導體元件的特性好壞與否，對於無線通訊產品的品質更扮演著舉足輕重的關鍵。為了提供高頻元件的製程及元件設計者更快速且詳實的元件特性，以作為進一步改良之依據；並且同時精準地提供電路設計者所需的相關資訊，高頻元件測試乃為一非常重要之關鍵技術。

13.3.1 量測方法

RF 測試元件的設計方面，由於在電路效能的考量下，多使用多指狀結構（Multi-Finger）來增加元件寬度，有效增加元件電流，因此 RF 測試元件的設計上也採用 Multi-Finger 的設計方式來滿足電路設計者的需求。量測法主要是利用經特殊設計的微波探針（Microwave Probes）作為同軸電纜（Coaxial Cable）